Поиск и устранение неисправностей или отказов, прогнозирование сроков безотказной работы электрооборудования на основе статистических данных.

Таким образом, развитие средств и методов технической диагностики является важным фактором дальнейшего совершенствования процесса эксплуатации электрооборудования, обеспечивающего его безопасность и возможность предупреждения аварийных режимов работы и внезапных отказов.

УЛК 535 4+535-92

ПРИНЦИПЫ УСТРОЙСТВ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА МЕХАНИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ С ВНУТРЕННИМИ И ВНЕШНИМИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ

Рыжевич А. А. 1,2 канд. физ.-мат. наук. Солоневич С. В. 2

Белорусский государственный аграрный технический университет, ⁷ Институт физики им. Б. И. Степанова НАН Беларуси г. Минск, Республика Беларусь

В современном производстве, в том числе и в сельскохозяйственном, широко используются детали, имеющие внешние и внутренние цилиндрические поверхности (валы, втулки, трубы). В ряде случаев к качеству этих поверхностей с точки зрения чистоты. шероховатости и, самое главное, механической целостности, предъявляется ряд требований. В настоящее время для автоматического контроля качества поверхностей достаточно широко используются профилометры, основанные на координатном сканировании поверхности. За длительное время своей эксплуатации они хорощо себя зарекомендовали, обладая при этом очевидными недостатками: они измеряют в каждый момент времени качество поверхности только в некоторой достаточно малой области. При этом передвижение приборов между различными контролируемыми точками уменьшает точность измерений и требует значительного времени. Этих недостатков лишены лазерные профилометры. предназначенные для определения качества поверхностей, имеющих цилиндрическую форму [1-3]. Особенно большой точностью отличаются профилометры, основанные на интерферометрии [4], позволяющие обнаруживать единичные дефекты поверхности малых Однако зачастую на производстве необходимо производить быстрый автоматический анализ качества большого количества однотипных деталей с последующей отбраковкой некачественных деталей. Для этих целей разработан и экспериментально реализован лазерный Фурье-профилометр дальнего поля в двух модификациях - для контроля внешних и внутренних поверхностей (рис. 1, а и б соответственно), позволяющий оперативно определять качество поверхностей в диалоговом режиме. Схема профилометра обеспечивает фокусировку линзой 5 отраженного объектом поля в фокальной плоскости линзы Выходной сигнал профилометра представляет собой двухмерный спектр Фурье в виде кольца. Радиальная структура Фурье-спектра интегрально по продольной координате отображает нарушения поверхности. Данный профилометр не требует опорной волны и поэтому имеет высокую устойчивость к колебаниям. Анализ выходного поля довольно прост и состоит в измерении ослабления интенсивности и уширения спектра Фурье как функции азимугального угла. Профилометры такого типа перспективны для контроля качества поверхностей как с плавными, так и резко выраженными неоднородностями-нарушениями.

Лазерный профилометр работает следующим образом. От источника лазерного излучения I гауссов расширенный телескопом 2 световой пучок направляется на коническую линзу (аксикон) 3. Сформированный посредством конических элементов 3 и 8 кольцевой конический световой пучок падает на контролируемый объект 4, отражаясь от которого,

фокусируется линзой 5 на приемник лазерного излучения - ССД-камеру 6. Методики проведения исследований на обоих модификациях профилометра аналогичны и включают в себя юстировку оптической схемы, установку образцов, регистрацию Фурье-спектров и обработку полученных данных.

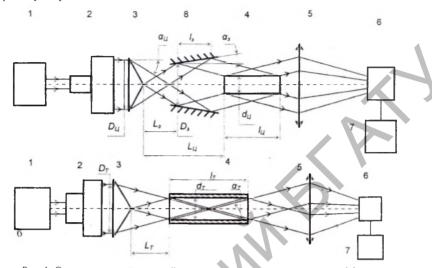


Рис. 1. Оптические схемы устройств для контроля качества внешних (а) и внутренних (б) цилиндрических поверхностей: 1 - лазер, 2 - перестраиваемый телескоп, 3 перестраиваемый аксикон, 4-контролируемый образец, 5 - линза, 6 - ССД-камера, 7 - ЭВМ, 8 -коническое зеркало

Параметры измеряемых деталей связаны соотношениями с параметрами оптических элементов, использующихся в схемах устройств. В модификации a длиной $l_{\mathcal{U}}$ и диаметром $d_{\mathcal{U}}$ объекта параметры оптических элементов определяются уравнениями $\frac{D_{il}}{2lg(\alpha_{il}-2\alpha_{i})}=l_{il}$,

$$2D_{\mathcal{U}}-L_{\mathcal{U}} \mathsf{t} \mathsf{g}(\alpha_{\mathcal{U}}-2\alpha_{\tau})=d_{\mathcal{U}}, L=\frac{1}{2}(L_{\mathcal{U}}+\frac{d_{\mathcal{U}}}{2}\,\mathsf{t} \mathsf{g}\alpha_{\mathcal{U}}), \ l_{\tau}=\frac{D_{\mathcal{U}}\sin(\alpha_{\mathcal{U}})\cos(\alpha_{\tau})}{2\mathsf{t} \mathsf{g}(\alpha_{\mathcal{U}})\sin(\alpha_{\mathcal{U}}-\alpha_{\tau})}, \ \text{a в модификации}$$
 δ – уравнениями $\alpha_{\tau}=arctg\frac{d_{\tau}}{l_{\tau}}; \qquad D_{\tau}=2d_{\tau}; \qquad L_{\tau}=\frac{D_{\tau}}{4\mathsf{t} \mathsf{g}(\alpha_{\tau})}.$ Гибкость оптической схемы,

$$\delta$$
 – уравнениями $\alpha_{\tau} = arctg \frac{d_{\tau}}{l_{\tau}}; \qquad D_{\tau} = 2d_{\tau}; \qquad L_{\tau} = \frac{D_{\tau}}{4tg(\alpha_{\tau})}$. Гибкость оптической схемы,

т.е. возможность ее подстройки под конкретные изделия обеспечивают перестраиваемые оптические элементы 2 и 3.

При проведении исследований на наличие отклонений формы в виде выпуклостей использовались образцы с дефектами различных размеров. Полученные профилограммы (рис. 2) наглядно показывают, что при наличии дефекта интенсивность излучения, отраженного от поверхности образца, уменьшается, и чем больше высота и количество дефектов, тем меньше интенсивность на соответствующем участке спектра.

Для контроля очень протяженных цилиндрических объектов, малая жесткость на изгиб которых не позволяет производить формирование Фурье-спектров, может использоваться устройство, схема которого представлена на рис. 3. Пучок от источника лазерного излучения 3 расширяется телескопом 4 и, отражаясь коническим зеркалом 5, попадает на контролируемую поверхность 1. На ней происходит частичное падение интенсивности пучка и разрушение его пространственной структуры из-за влияния различных дефектов поверхности, её загрязнения, шероховатости и других параметров, характеризующих качество поверхности. Отраженный поверхностью свет регистрируется кольцевой ПЗС-матрицей 6, данные от которой передаются на удаленный компьютер для анализа. Оптическая схема вместе с датчиком перемещения закреплена в подвижном модуле 2, перемещаемом вдоль исследуемой поверхности.



Рис. 2. Профилограммы образцов без (a) и с (δ) поверхностными дефектами (изображение инвертировано, стрелкой указано место, соответствующее дефекту)

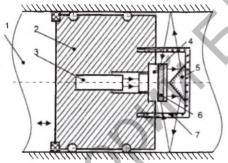


Рис. 3. Принципиальная схема оптико-механического устройства для контроля: 1 - контролируемая поверхность, 2 - перемещаемый модуль, 3 - лазер, 4 - телескоп, 5 - коническое зеркало, 6 - кольцевая ПЗС-матрица, 7 - стеклянный стакан

Преимуществами данного устройства являются возможность его применения для контроля слабоизогнутых цилиндрических объектов различных диаметров, высокая скорость контроля, хорошая точность локализации дефектов поверхности и достаточно высокое разрешение по размеру дефектов.

ЛИТЕРАТУРА

K.G. Birch Oblique incidence interferometry applied to non-optical surfaces // J. Phys. -1973. - Vol.E6, Ne10. -P. 1045 - 1048.

Grazing-incidence interferometry applied to the measurement of cylindrical surfaces. T. Dresel, J. Schwider, A. Wehrhahn S. Babin. // Opt. Eng. – 1995. – Vol.34. – P. 3531 – 3535.

Grazing-incidence test for cylindrical microlenses with high numerical aperture. J. Schwider, N. Lindlein, R. Schreiner e. a. // J. Opt. A: Pure Appl. Opt. – 2002. – Vol.4. – P. 10–16.

Inerferometric testing of plane and cylindrical workpieces with computer-generating holograms. S. Brinkman, R. Schreiner, T. Dresel J. Schwider. // Opt. Eng. – 1998. – Vol.37. – P. 2506-2511.